# 気液界面プラズマの発光分光診断

Diagnostics of gas-liquid interfacial plasma using optical emission spectroscopy 名城大理工, °(M1)大澤 郁実, 才田 隆広, 太田 貴之 Meijo Univ., °Ikumi Ohsawa, Takahiro Saida, Takayuki Ohta E-mail: 193427009@ccalumni.meijo-u.ac.jp

### 1.はじめに

気相と液相に配置された電極間の放電に よって生成される気液界面プラズマは、気 相中で生成された電子やラジカルにより液 中反応を誘起させて対象物質へ処理を行う。 気液界面プラズマは気相中で放電されるた め絶縁破壊が容易であることと、気相のガ スを変化させることによって様々な粒子種 を液中に供給することが可能である。我々 は、これまでに気液界面プラズマを用いた 還元反応を用いて銅ナノ粒子の合成を行っ てきており<sup>[1]</sup>、この合成メカニズムを解明 するためには気相診断を行うことが重要で ある。

本研究では発光分光法により、気液界面 プラズマの特性を調査した。

## 2.実験方法

気液界面プラズマ源の電極間距離を 10mm、電極と液面間の距離を 5mm とした。 アルゴンと水素の混合ガスを流量 2.0slm で 流し、周波数 60Hz の印加電圧を 4kV から 21kV まで変化させた。

## 3.実験結果

図 1 に OH (307.9nm)、H<sub>α</sub> (656.5nm) 及び Ar (763.7nm)の発光スペクトルを示す。 図 2 には、各粒子の発光強度の印加電圧依 存性を示す。印加電圧を増加させると、発 光強度は増加し、17kV以上では H<sub>α</sub>と Ar の 発光強度が急激に大きくなった。電子密度 及び電子温度が増加し、H<sub>2</sub>O や H<sub>2</sub>からの電 子衝突解離による H 原子の生成が促進され たことが示唆される。

#### 4.参考文献

[1] 伊藤 他、 第 64 回応用物理学会春季学 術講演会、 16a-315-9 (2017).



